

IGBT测试解决方案

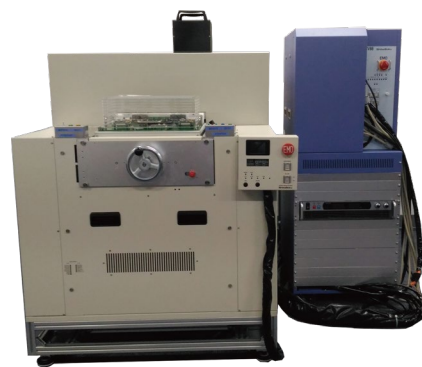
提供满足前沿技术需求的功率器件测试，满足大电压(2000V)、大电流(6000A)产品测试需求，并支持KGD(Known Good Die) Chip测试，让MCP(多芯片封装)或SiP(系统级封装)的良率提升，减少封装成本因Bad Die所造成的浪费。

产品优势

- ✓ 兼具AC和DC高电压大电流测试系统
- ✓ 满足多站式高温 / 常温测试并测需求

功能特色

- ✓ 使用简易的填表式开发程序
- ✓ 满足车载电子到功率器件测试不同需求



AC Test System



DC Test System

AC Test System

- MOSFET / IGBT的动态测试系统
- 具备能符合di/dt、dv/dt测试需求的波形分析功能
- 符合高速切换器件的测试需求
- 优越的极低寄生电感控制，以真实再现器件规格书的数据
- 内建Real Time侦测异常电压、电流并执行快速切断的保护功能
- 填表式程序开发工具(PIPG)，方便使用者快速开发程序

DC Test System

- 配置有阈值电压测试(Vth)专用测试功能
- 对应大电流Vth、高电压Vth、小电流Vth测试
- SLOT构造，维修检查方便
- 高速大电流源
- 填表式程序开发工具(PIPG)，方便使用者快速开发程序

规格

- ✓ 可执行L-SW, RRSOA, RBSOA, SCSOA, Qg, Ava 等测试项目
- ✓ 电压能力：1200V
- ✓ 电流能力：2400A (SCSOA : 6000A)

规格

- ✓ 可执行IGES, ICES, Bvces, VGE, VGSE, VCSE, ICSE, ISEC 等测试项目
- ✓ 电压能力：2000V
- ✓ 电流能力：1600A

